

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年11月26日(26.11.2020)



(10) 国際公開番号

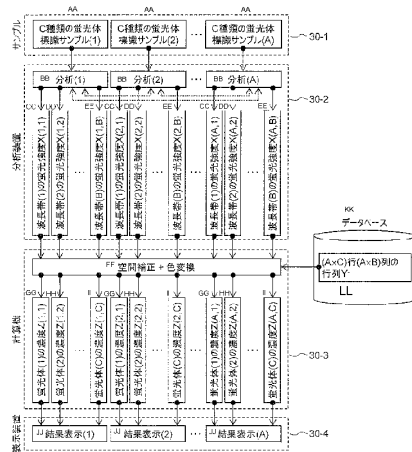
WO 2020/235283 A1

- (51) 国際特許分類:
C12M 1/00 (2006.01) G01N 21/64 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01) G01N 27/447 (2006.01)
G01N 21/59 (2006.01) C12Q 1/6869 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/017202
- (22) 国際出願日: 2020年4月21日(21.04.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-096011 2019年5月22日(22.05.2019) JP
- (71) 出願人: 株式会社日立ハイテク
(HITACHI HIGH-TECH CORPORATION) [JP/JP]; 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 穴 沢 隆 (ANAZAWA Takashi); 〒1008280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株式会社日立製作所内 Tokyo (JP). 伊名波良仁(INABA Ryoji); 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 株式会社日立ハイテク内 Tokyo (JP). 山本 周平(YAMAMOTO Shuhei); 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 株式会社日立ハイテク内 Tokyo (JP). 中澤 太朗(NAKAZAWA Taro); 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 株式会社日立ハイテク内 Tokyo (JP). 藤岡 満(FUJIOKA Michiru); 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 株式会社日立ハイテク内 Tokyo (JP). 山

(54) Title: ANALYSIS DEVICE AND ANALYSIS METHOD

(54) 発明の名称: 分析装置および分析方法

図 30



- 30-1 Sample
30-2 Analysis device
30-3 Calculator
30-4 Display device
AA Sample labelled with C types of fluorescent bodies
BB Analysis
CC Fluorescent intensity of wavelength band (1)
DD Fluorescent intensity of wavelength band (2)
EE Fluorescent intensity of wavelength band (B)
FF Spatial correction + color correction
GG Concentration of fluorescent body (1)
HH Concentration of fluorescent body (2)
II Concentration of fluorescent body (C)
JJ Result display
KK Database
LL Matrix Y with (A x C) rows and (A x B) columns

(57) Abstract: In analysis methods and analysis devices for identifying light emitted by multiple types of fluorescent bodies from a plurality of light emission points by detecting fluorescent light from each light emission point at each of a plurality of wavelength bands, spatial crosstalk and spectral crosstalk exist between signal intensities of the plurality of light emission points and between those of the plurality of wavelength bands, resulting in reduced identification performance. In the present invention, all detection signals of the plurality of wavelength bands from each of the plurality of

[続葉有]

崎 基博(YAMAZAKI Motohiro); 〒1056409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 株式会社日立ハイテク内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人平木国際特許事務所 (HIRAKI & ASSOCIATES); 〒1056232 東京都港区愛宕二丁目5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー32階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

light emission points are input to a predetermined formula to cancel the spatial crosstalk and spectral crosstalk and derive the concentration of each fluorescent body at each light emission point.

(57) 要約: 複数の発光点からの、複数種類の蛍光体の発光を識別するため、各発光点からの蛍光をそれぞれ複数の波長帯で検出する分析方法および分析装置において、複数の発光点および複数の波長帯の信号強度の間に空間クロストークおよびスペクトルクロストークが存在し、上記識別の性能が低下する。予め定められた演算式に、複数の発光点それぞれの、複数の波長帯での検出信号のすべてを入力することによって、空間クロストークおよびスペクトルクロストークを解消し、各発光点における各発光体の濃度を導出する。